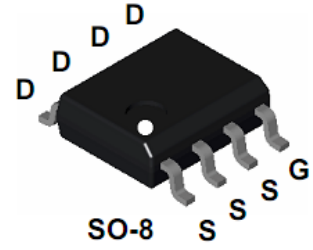


LYNM7815SP (进口芯片) 型 N 沟道 MOS 场效应晶体管

特性

- 参照执行标准：QZJ840611, Q/RBJ1019QZ-2015
- 封装形式：SO-8
- 开关速度快，输入阻抗高，驱动功耗小，安全工作区宽，温度稳定性好
- 产品为非国产化



极限参数

- 贮存温度 T_{stg} : $-55^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
- 工作温度 T_{amb} : $-55^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
- 焊接温度不超过 260°C ，焊接时间不超过 10 秒

器件型号	额定功率 P_D (W)	漏源电压 BV_{DSS} (V)	栅源电压 V_{GS} (V)	漏极电流 I_D (A)	导通电阻 R_{DS} ($m\Omega$)	热阻 $R_{th(j-A)}$ ($^{\circ}\text{C/W}$)
LYNM7815SP	2.5 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)	150	± 20	5.1 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)	43	50

主要电特性 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小值	典型值	最大值	
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	150	—	—	V
零栅压漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS}=150V, V_{GS}=0V$	—	—	20	μA
		$V_{DS}=150V, V_{GS}=0V, T_j=125^{\circ}\text{C}$	—	—	250	μA
正向栅极漏电流	I_{GSSF}	$V_{GS}=20V, V_{DS}=0V$	—	—	100	nA
反向栅极漏电流	I_{GSSR}	$V_{GS}=-20V, V_{DS}=0V$	—	—	-100	nA
开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=100\mu A$	3.0	—	5.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=3.1A$	—	—	43	$m\Omega$
跨导	g_{FS}	$V_{DS}=10V, I_D=3.1A$	1.0	—	—	S
电容	C_{ISS}	$V_{DS}=75V, V_{GS}=0V, f=1.0\text{MHz}$	—	1647	—	pF
	C_{OSS}	$V_{DS}=75V, V_{GS}=0V, f=1.0\text{MHz}$	—	129	—	pF

SO-8 封装尺寸图

